
**Spécification géométrique des
produits (GPS) — État de surface:
Méthode du profil — Étalonnage des
instruments à contact (palpeur)**

*Geometrical product specifications (GPS) — Surface texture: Profile
method — Calibration of contact (stylus) instruments*

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

ISO 12179:2021

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/75c23903-d283-4027-af12-8e3342c11ee9/iso-12179-2021>



iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

ISO 12179:2021

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/75c23903-d283-4027-af12-8e3342c11ee9/iso-12179-2021>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2021

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, ou la diffusion sur l'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut être demandée à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genève
Tél.: +41 22 749 01 11
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos	v
Introduction	vi
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes et définitions	1
4 Conditions d'utilisation	3
4.1 Composants et configurations d'un instrument à contact (palpeur)	3
4.2 Étalonnage d'une configuration	3
4.3 Lieu de l'étalonnage	3
4.4 Défauts	3
5 Étalons de mesure	3
6 Caractéristiques métrologiques des instruments à contact (palpeur)	6
6.1 Généralités	6
6.2 Étalonnage du profil résiduel	6
6.3 Étalonnage de la composante verticale du profil	6
6.4 Étalonnage de la composante horizontale du profil	6
6.5 Étalonnage du système de coordonnées du profil	6
6.6 Étalonnage de l'instrument à contact (palpeur) dans son ensemble	6
7 Étalonnage	7
7.1 Préparation de l'étalonnage	7
7.2 Évaluation du profil résiduel	7
7.3 Étalonnage du profil de la composante verticale du profil	7
7.3.1 Objectif global	7
7.3.2 Procédure	7
7.4 Étalonnage de la composante horizontale du profil	8
7.4.1 Objectif global	8
7.4.2 Procédure	8
7.5 Étalonnage du système de coordonnées du profil	8
7.5.1 Objectif global	8
7.5.2 Mode opératoire	8
7.6 Étalonnage de l'instrument à contact (palpeur) dans son ensemble	8
7.6.1 Objectif global	8
7.6.2 Mode opératoire	8
7.7 Autres étalonnages	9
8 Incertitude de mesure	9
8.1 Information issue du certificat d'étalonnage d'un étalon	9
8.2 Incertitude sur les valeurs mesurées pendant l'étalonnage d'un instrument de mesure utilisant un étalon	9
9 Certificat d'étalonnage des instruments à contact (palpeur)	10
10 Information générale	10
Annexe A (normative) Étalonnage des instruments mesurant les paramètres liés aux motifs	11
Annexe B (normative) Étalonnage d'instruments liés à l'opérateur simplifié pour la mesure d'état de surface	13
Annexe C (informative) Exemple: paramètre <i>Ra</i> d'étalon de rugosité	14
Annexe D (informative) Schéma conceptuel	17
Annexe E (informative) Vue d'ensemble des normes de profil et de surface dans le modèle de matrice GPS	18

Annexe F (informative) Relation avec le modèle de matrice GPS	19
Bibliographie.....	20

iTeh Standards
(<https://standards.itih.ai>)
Document Preview

[ISO 12179:2021](https://standards.itih.ai/catalog/standards/iso/75c23903-d283-4027-af12-8e3342c11ee9/iso-12179-2021)

<https://standards.itih.ai/catalog/standards/iso/75c23903-d283-4027-af12-8e3342c11ee9/iso-12179-2021>